

＜超音波探傷試験技術者 資格試験＞  
2010年春期UT二次再試験受験者への注意事項

1. 二次再試験受験者全員に共通の注意事項

- (1) 前回（2009年秋期）と同じ条件での試験を実施する。  
試験時間、試験内容とも変更点はない。
- (2) アナログ探傷器の使用を基本とするが、J S N D I で準備するデジタル探傷器の使用も認める。どちらを使うかは、受験者が会場で選択する。  
なお、デジタル探傷器を選んだ場合、新規試験で設定している「探傷器の操作確認の時間」はないので注意すること。  
また、デジタル探傷器の機種が試験地区により異なるので「受験申請補足資料-B」を参照のこと。
- (3) デジタル探傷器持込み受験についても従来通りである（事前の申請者に限る）。

2. レベル1の二次再試験受験者のみに関する注意事項

- (1) J S N D I で準備するデジタル探傷器による受験者及びデジタル探傷器持込み受験者は、斜角探傷においてSTB-A2（φ4×4）によるエコー高さ区分線の作成が必要である（持込み受験者は従来から同じ）。  
エコー高さ区分線の作成には、デジタル探傷器の持つ作成機能を用いること。H線はSTB-A2 φ4×4（0.5S）：80～100%として作成し、測定範囲125mmで探傷する。
- (2) アナログ探傷器による受験者は、あらかじめエコー高さ区分線が描かれているので、そのエコー高さ区分線を利用して探傷する。
- (3) 試験時間・内容は前回と同じ（垂直15分、斜角30分、データ整理30分）である。

3. レベル2（・3\*）の二次再試験受験者のみに関する注意事項

- (1) J S N D I のアナログ・デジタル探傷器による受験、及び、デジタル探傷器持込み受験、いずれの場合も前回と同じ試験時間・内容（指示書作成30分（レベル2のみ）、垂直15分、斜角50分、データ整理30分）である。
- (2) 斜角探傷におけるエコー高さ区分線作成は、従来通り4箇所（1/4S, 2/5S, 3/4S, 5/4S）の測定・プロットとする。
- (3) J S N D I で準備するデジタル探傷器による受験者及びデジタル探傷器持込み受験者は、エコー高さ区分線作成に探傷器の持つ作成機能を用いること。H線はRB-41 No.2 φ3（1/4S）：80～100%として作成し、測定範囲200mmで探傷する。

\*レベル3二次再試験受験者で、レベル2資格を有していないもの